

2009 年高可靠度電子產品技術研討會

隨著電子產品在各車輛產業及商用產品的急速增加，國外電子大廠，已針對各電子產品之特殊應用環境需求與效應進行評估及驗證，以提高產品之可靠度。反觀國內產業環境，由於電子廠大多受技術母廠之限制或者依循既有廠規執行可靠度驗證，對於自主開發新產品所需可靠度評估技術則是欠缺的。由於近年來電子產品品質與可靠度的改善，電子產品壽命越來越長，藉由壽命試驗來驗證產品可靠度的難度相對增高。對於產品可靠度的掌握，除了加速壽命試驗之外，可靠度預估技術的應用仍是評估電子產品可靠度較符合成本效益的方法。

本研討會就可靠度設計分析、環境效應與失效模式、加速壽命試驗規劃與分析、電子封裝可靠度評估、環境與可靠度試驗方法技術等議題，邀請國內在可靠度領域學有專精之研究人員及學界教授，從基礎理論到實際工作經驗對現代可靠度評估技術做一整體說明，以期建立現代商用電子產品可靠度評估的共識與能量。

✧ 講師：彭鴻霖 太空中心 研究員
許芳勳 中山科學研究院 研究員
廖建義 中山科學研究院 研究員
陳永樹 元智大學 教授
林根源 車輛中心 環測課課長

✧ 時間：98 年 9 月 24 日(三)，共計 1 天〈如遇颱風將通知延後一週至 10 月 1 日舉行〉。

✧ 費用：免費(含講義、文具、午餐)。

✧ 名額：計約 120 名，額滿為止，恕不增加。

✧ 聯絡人：陳麗惠小姐 lihchen@nspo.org.tw TEL:03-5784208#8090

郭芳伶小姐 landy@artc.org.tw TEL:04-7811222#5213

✧ 上課地點：新竹太空中心整測廠房 2 樓。

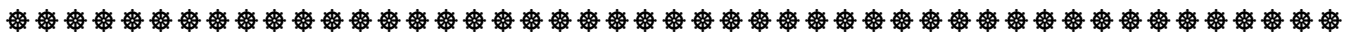
✧ 地址：新竹科學園區展業一路 15 號。

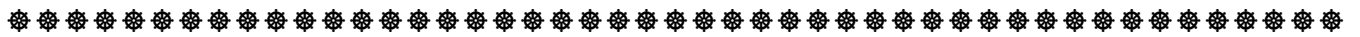
※ 報名手續：

1.請 9 月 18 日前傳真：03-5784224 回覆報名表，或至本中心網站報名(www.nspo.org.tw)。

主辦單位：財團法人國家實驗研究院 國家太空中心
財團法人車輛研究測試中心

合辦





2009 年高可靠度電子產品技術研討會

※ 課程內容：現場以中文演說。

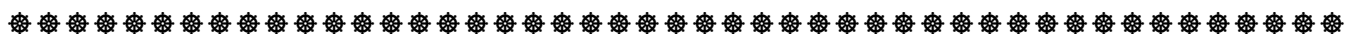
課程主題	高可靠度電子產品技術	
時 間	9 月 24 日(四)	
	課 程 內 容	講 師
08：30～09：00	報到	
09：00～09：10	主席致詞	
09：10～10：00	可靠度設計分析	彭鴻霖
10：00～10：10	休息	
10：10～11：00	環境效應與失效模式	許芳勳
11：00～11：10	休息	
11：10～12：00	加速壽命試驗規劃與分析	廖建義
12：00～13：00	午餐	
13：00～13：50	電子封裝可靠度評估	陳永樹
13：50～14：00	休息	
14：00～14：50	環境與可靠度試驗方法	林根源
14：50～15：00	休息	
15：00～16：00	意見交流	

TO:財團法人太空中心 陳麗惠小姐 傳真: 03-5784224

「2009 年高可靠度電子產品技術研討會報名表」報名表

公司全銜：		聯絡人：	
		電 話： 分機	
		傳 真：	
地 址：		E-mail:	
姓 名	職 稱	餐 飲 (午餐)	
		<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 素食
		<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 素食
		<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 素食
		<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 素食
		<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 素食

註：本頁若不敷填寫，請自行影印。



2009 年高可靠度電子產品技術研討會

※太空中心位置圖



新竹會場聯絡人：陳麗惠 小姐(分機 8090) 或蔡明憲 先生(分機 9191， nicolas@nspo.org.tw)

電話：03-5784208

地址：新竹科學園區展業一路 15 號

網址：車輛中心 www.artc.org.tw

太空中心 www.nspo.org.tw